



LNQE-Kolloquium

Mittwoch, 10.12.08 um 17:30 - 18:30 Uhr

+ anschließendes Beisammensein

Hörsaal im LfI (Schneiderberg 32, 30167 Hannover, Deutschland)

“Analytisches aus der Speicher-Entwicklung”

Dr. Steffen Teichert

Principal Physical Failure Analysis, Surface-/Material Analysis
Oimonda Dresden GmbH & Co. OHG, Königsbrücker Straße 180, D-01099 Dresden

In einer Einführung werden Herausforderungen der aktuellen DRAM-Entwicklung für Technologieknoten ≤ 65 nm erläutert und ein Ausblick auf die Technologie-Roadmap für die nächsten Jahre gegeben. Insbesondere werden DRAM-spezifische Anforderungen an neue Materialien und der Einsatz materialanalytischer Verfahren unter industriellen Bedingungen diskutiert. Mit einigen Beispielen zum Wachstum und zur Kristallisation von high-k Dielektrika und zur Analyse von Kontaktstrukturen werden Einsatzfelder moderner materialanalytischer Verfahren illustriert.